

Revue française de métrologie

Sommaire

Exactitude et stabilité du Temps atomique français TA(F), par D. VALAT, M. ABGRALL et P. UHRICH	3
Moyens de caractérisation des surfaces et leurs applications en métrologie, par Z. SILVESTRI, D. DU COLOMBIER, S. MACÉ et P. PINOT	11
Etalonnage d'un analyseur de réseau vectoriel à partir d'un atténuateur pour des mesures sous pointes, par D. ALLAL, M. BAHOUICHE, E. BERGEAULT et A. LITWIN	21
Instrumentation et gestion numérique des temps morts pour la métrologie de la radioactivité, par B. CENSIER, Ch. BOBIN et J. BOUCHARD	27

Contents

Accuracy and stability of the French atomic time scale TA(F), by D. VALAT, M. ABGRALL and P. UHRICH	3
Surface characterization devices and their applications in metrology, by Z. SILVESTRI, D. DU COLOMBIER, S. MACÉ and P. PINOT	11
Attenuator based vector network analyser calibration for on-wafer measurements, by D. ALLAL, M. BAHOUICHE, E. BERGEAULT and A. LITWIN	21
Digital instrumentation and dead-time processing for radionuclide metrology, by B. CENSIER, Ch. BOBIN and J. BOUCHARD	27